XXV Congresso de Iniciação Científica da Unicamp

18 a 20 Outubro Campinas | Brasil

ESPALHAMENTO RAMAN INTENSIFICADO POR SUPERFÍCIE EM ÓXIDOS SEMICONDUCTORES NÃO ESTEQUIOMÉTRICOS

Alice Cosenza Reinaldo*, Isaías de Castro Silva, Italo Odone Mazali.

Resumo

Neste trabalho buscou-se avaliar a intensificação do espalhamento Raman do ácido 4-mercaptobenzóico (4-MBA) adsorvido em óxido de cério não estequiométrico, por meio da criação de vacâncias de oxigênio. Foi possível identificar a molécula, e esse fato, além das mudanças espectrais observadas podem ser atribuídas à quimissorção do 4-MBA.

Palavras-chave:

Semicondutores, Raman, Não estequiometria.

Introdução

O espalhamento Raman intensificado por superfície (SERS) consiste em uma poderosa técnica espectroscópica na identificação de espécies, que utiliza a adsorção de uma molécula de interesse numa superfície, intensificando seu espalhamento Raman. No entanto, essa ferramenta ainda é dominada pelo uso de nanopartículas dos metais Au, Ag e Cu como superfícies intensificadoras, devido a sua propriedade de ressonância de plásmon. O SERS também é observado em nanopartículas de óxidos semicondutores, como CuO¹. O desafio consiste em maximizar o fator de intensificação do espalhamento Raman com o semiconductor CeO₂, a partir da promoção de não estequiometria por meio de vacâncias de oxigênio.

A produção de vacâncias pode representar um método simples de ajustar a energia dos níveis eletrônicos envolvidos nas transferências de carga responsáveis pela intensificação do sinal.^{2,3} Neste trabalho, nanobastões de CeO₂ foram utilizados como intensificadores do espalhamento Raman. Os mesmos foram obtidos por síntese hidrotérmica.⁴ A morfologia de nanobastões foi escolhida pois, a partir de um processo de cominuição, há a exposição de planos mais reativos frente a reação de formação das vacâncias de oxigênio desejadas.⁵

Resultados e Discussão

A identificação da formação de nanobastões de CeO₂ foi realizada a partir de XRD e TEM do sólido obtido. Uma estimativa do tamanho de cristalito, obtido pela equação de Scherrer, foi de 12 nm, compatível com a espessura dos bastões vistos nas imagens de TEM.

Figura 1. Difratoograma de raios X e TEM dos nanobastões CeO₂ como sintetizados.

O valor da banda proibida determinado para o CeO₂ foi de 3,2 eV.

Além disso, no espectro Raman foi observada a banda em 463,5 cm⁻¹, atribuída ao modo T_{2g} do CeO₂. A formação de vacâncias se deu pela reação de redução no estado sólido dos nanobastões de CeO₂ com NaBH₄. A identificação das vacâncias de oxigênio se deu por meio do deslocamento da banda T_{2g} para o valor de 461,2 cm⁻¹. A molécula de prova para o SERS foi o 4-MBA. A espécie foi adsorvida no CeO₂ reduzido por meio da dispersão de 20 mg do mesmo em 10 mL de uma solução de 4-MBA 10⁻³ mol L⁻¹ em etanol degasado. O produto foi lavado 10 vezes com etanol degasado a fim de remover o excesso de 4-MBA. Foram obtidos os espectros Raman do ácido puro e adsorvido no CeO₂ reduzido. No espectro referente ao ácido adsorvido, foi possível observar as bandas correspondentes ao 4-MBA, o que evidencia um efeito de intensificação por meio da adsorção. Como foram feitas sucessivas lavagens, pode-se afirmar que se deve, exclusivamente, as poucas moléculas quimissorvidas.

Figura 2. Espectros Raman 4-MBA puro e adsorvido em nanobastões de CeO₂.

Conclusões

De acordo com os resultados obtidos, foi possível observar espalhamento Raman do 4-MBA adsorvido no CeO₂ não estequiométrico. Acredita-se que a observação das bandas é um indicio de intensificação proveniente da quimissorção do 4-MBA no CeO₂ reduzido, uma vez que algumas bandas apresentam seus máximos deslocados.

Agradecimentos

CNPq, LMEOA-Fapesp, IQ-Unicamp

¹ Wang, Y.; Hu, H.; Jing, S.; et al. *Anal Sci.* 200, 23, 787.

² Lombardi, J. R.; Birke, R. L. *Acc Chem Res.* 2009, 42, 734.

³ Cong, S.; Yuan, Y.; Chen, Z.; et al. *Nat Commun.* 2015, 6, 7800.

⁴ Mai, H. X.; et al. *J Phys Chem B.* 2005, 109, 24380.

⁵ Silva, I. C.; Sigoli, F. A.; Mazali, I. O. *J Phys Chem C.* 2017, 121, 12928.

DOI: 10.19146/pibic-2017-78058